

# コンパクトESD試験器

## HCE-5000

**低コスト・省スペースのESDテスターが実現！！**

近年のデバイスの微小化に伴い、ESD耐量の向上が要求されています。そこで、弊社では試験操作が簡単で、持ち運び可能な静電破壊試験器を開発しました。本装置はリーク測定機能も備えていますので、ESDによる破壊判定を本装置のみで行うことができます。



印加ユニット

## 本装置の特徴

### タッチパネルで簡単操作

タッチパネルの採用により、PCを使用せず本装置のみで印加測定が可能です。

### 各規格波形に対応

JEITA/JEDEC/ESDA/AEC-Q100のHBM/MM規格波形に準拠しています。

### リーク測定機能

ESD印加後、リーク測定を行う事で破壊判定が可能です。

判定方法は下記の2種類を備えています。

変化量判定: 測定値が、初期リーク値から設定した値(割合)以上の変化があった場合に破壊判定とします。

絶対値判定: 測定値が設定した値を超えた場合に破壊判定とします。

### HBM Fast/Slowユニット (オプション)

HBM波形の立ち上がり速度が異なる2種類のユニットを用意しました。

Fastユニット = 2~3ns, Slowユニット = 8~10ns (標準ユニット = 5~7ns)

# 画面レイアウト

## 印加画面

充電電圧

印加回数

印加極性

手動印加の設定画面です。この画面で印加条件を指定します。

## 測定条件画面

判定方法

絶対値判定

上限

下限

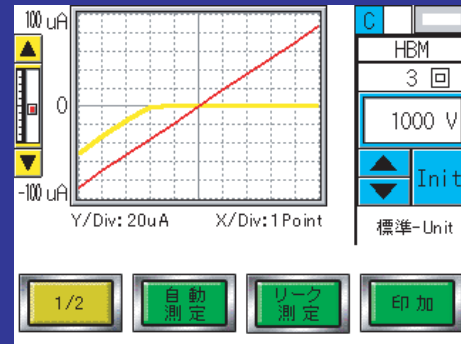
変化量判定

許容値

割合

測定条件の設定画面です。この画面で破壊判定の条件を設定します。

## 結果画面



< グラフ表示 >

0.02 V	0.05 V	0.08 V	0.11 V	0.13 V
17.2 uA	34.5 uA	51.7 uA	69.0 uA	86.2 uA

< 表表示 >

測定結果は2種類の表示方法を備えています。1つはI/Vカーブを表示する<グラフ表示>、もう1つは電圧値・電流値を表示する<表表示>です。

# 標準仕様

試験器モデル	HCE-5000
充電電圧	10V~4kV (5V分解能) Option HBM(10kV)
充電電圧精度	1%設定値±10V
印加極性	+/-
印加回数	1~99回
インターバル時間	0.1S~9.9S / Step 0.1S
標準ユニット	HBM=4kV, MM=4kV
準拠規格波形	JEITA/JEDEC/ESDA/AEC-Q100
リーク測定電圧	±40V / Step 0.1V
リーク測定電圧精度	1%±50mV (100kΩ負荷)
リーク測定電流	MAX 100mA
I/V測定精度	1%±1/500F.S.±10nA (分解能設定 = High)
測定ポイント	正負各々最大20ポイント
リーク測定抵抗	10/100/1k/10k/100k/1M (Ω) (マニュアル設定、正負各々設定可)

オプションユニット	HBM(Fast/Slow),HBM(10kV),IEC
電源電圧	標準 AC100V 2A
外形寸法	350(W)×200(D)×296(H)
重量	約10kg
外部データ出力	RS-232C
動作温度範囲	15~35 °C
動作湿度範囲	70%RH以下(結露なきこと)

## 標準付属品



HANWA

阪和電子工業株式会社

〒649-6272 和歌山市大垣内689-3  
TEL:073-477-4435 FAX:073-477-3445  
URL: <http://www.hanwa-ei.co.jp/>

●代理店